Nozioni minime di machine learning per il corso di bioinformatica

Giorgio Valentini
DSI – Università degli Studi di Milano

1

Metodi di machine learning

- I metodi di apprendimento automatico (Machine Learning - ML) consentono di effettuare inferenze e predizioni da un insieme limitato di dati disponibili
- Gli algoritmi di ML "apprendono" una funzione predittiva utilizzando una serie di esempi (dati) estratti secondo una determinata distribuzione di probabilità dall' "Universo" dei dati.

Apprendimento induttivo

- Insieme finito di oggetti: $S = \{x_1, x_2, ..., x_n\}, S \subset U$
 - Obiettivo: apprendere una proprietà P di U dall'analisi di S tramite un algoritmo di apprendimento A.
 - Es. 1: Dato un insieme S sottoinsieme di U (universo delle proteine) predire per un x di U se x ha struttura secondaria α o β, utilizzando un algoritmo A(S).
 - Es. 2: Dato un insieme S sottoinsieme di U
 (universo dei pazienti) predire per un x di U se è
 sano o malato, utilizzando un algoritmo A(S).

Principali tipologie di problemi di ML

- 1. Problemi supervisionati:
 - Dati XCU (insieme di oggetti) e I(X) (etichette), predire $P(x), x \in U$ L'algoritmo A (eventualmente con parametri ω) utilizza X per costruire un predittore \hat{P} che approssimi P (non noto a priori $\forall x \in U$).
- Problemi non supervisionati:
 Dati XCU (insieme di oggetti) senza I(X)
 (etichette), predire P(x) (problema mal posto).
- Esistono anche altre tipologie di problemi.

Principali problemi supervisionati

- 1. <u>Problemi di classificazione</u>: P(x) è una funzione a valori discreti
- 2. <u>Problemi di regressione</u>: P(x) è una funzione a valori continui

Gli esempi delle slide precedenti erano relativi a problemi di classificazione.

5

Gli oggetti sono caratterizzati da feature

$$\phi: U \to F$$

$$Es: \phi(x) = z$$

$$z \in R^d opp$$
. $z \in N^d$

z può essere un vettore, una stringa, un albero, un grafo, ...

Un algoritmo A per apprendere P utilizza $\phi(S), S \subset U$

Algoritmi di di classificazione supervisionati

Un algoritmo A con parametri ω utilizza un data set S con etichette per generare un predittore (classificatore):

$$A(\phi(S), l(S), \omega) \rightarrow \hat{P}$$

Obiettivo della classificazione supervisionata:

$$P^* = \arg\min_{\hat{P}} Prob\Big(P(\phi(x)) \neq \hat{P}(\phi(x))\Big)$$
(per un *x* estratto a caso da *U*)

7

Stima dell'errore

- In pratica non si dispone di *U* e delle rispettive etichette.
- Ad es:. Si dispone solo di XCU (insieme di oggetti) e I(X) (etichette):
 - 1. Si partiziona X in $S \in T$
 - 2. Training: $A(\phi(S), l(S), \omega) \rightarrow \hat{P}$
 - 3. Testing: $\varepsilon = \frac{1}{|T|} \sum_{x \in T} I(P(\phi(x)) \neq \hat{P}(\phi(x)))$

I(z)=1 se z è vero, 0 altrimenti (funzione di perdita 0/1)

Tecniche di stima dell'errore

- La tecnica di stima dell' errore vista precedentemente è detta di hold-out
- Altre tecniche:
 - Hold-out multiplo
 - Cross-validation
 - Leave one out
 - Out-of-bag

- ...

• Scelta_del predittore:

Se $\varepsilon(\hat{P}_{\omega})$ è l'errore sul test set ottenuto dal predittore \hat{P} generato da A con parametri ω , allora:

$$\hat{P}_{\omega^*} = \arg\min_{\omega} \varepsilon(\hat{P}_{\omega})$$

9

Algoritmi di di classificazione non supervisionati

Un algoritmo A con parametri ω utilizza un data set S senza etichette per generare un *clustering*:

$$A(\phi(S),\omega) \to C_{\omega}$$

$$C_{\omega} = \{C_1, C_2, ..., C_n\}, C_i \subseteq S, 1 \le i \le n, \cup C_i = S$$

Se
$$\forall i, j \mid i \neq j, C_i \cap C_j = \emptyset$$

allora C_{ω} è una partizione

Problema: come valutare la qualità di C_{ω} ?